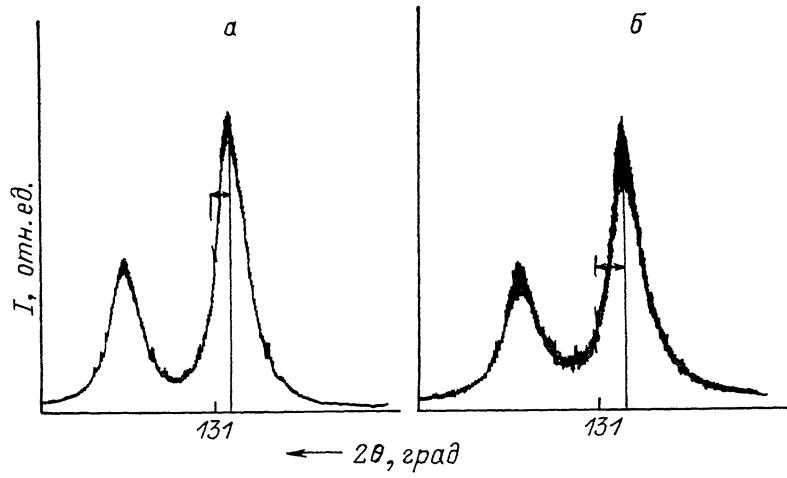


ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ ТЕЛЛУРИДА ВИСМУТА ПРИ САМОИНТЕРКАЛЯЦИИ МЕДЬЮ

Олешко Е. В., Велиюлин Э. И., Козыренко В. Н., Каҳраманов С. Ш.

Интерес к легированию теллурида висмута медью связан с возможностью протекания процесса самопроизвольного перераспределения этой примеси в объеме кристалла [1].

Слоистый характер кристаллической структуры матрицы Bi_2Te_3 [2] делает возможным перемещение атомов Cu из положений центров внедрения, где они находятся в активном донорном состоянии, в ван-дер-ваальсовы щели между пятислойными пакетами (квинтетами). При этом, согласно модели [3], атомы Cu упорядочиваются и становятся электрически нейтральными.



Дифракционные максимумы (12-й порядок) теллурида висмута.

a — $n\text{-}\text{Bi}_2\text{Te}_3$, *b* — $\text{Bi}_2\text{Te}_3\langle\text{Cu}\rangle$.

В настоящем сообщении предпринята попытка подтвердить эту модель на основании рентгеноструктурных исследований $\text{Bi}_2\text{Te}_3\langle\text{Cu}\rangle$, оптических измерений и результатов теоретических расчетов зонной структуры.

Рентгеноструктурные исследования образцов $n\text{-}\text{Bi}_2\text{Te}_3$ и $\text{Bi}_2\text{Te}_3\langle\text{Cu}\rangle$ проводились на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3М с использованием CuK_{α} -излучения. Для повышения точности определения параметра решетки измерялось угловое положение 12-го порядка дифракционной картины (см. рисунок). Основной параметр структуры — период повторения пятислойных пакетов (квинтетов) d равен 10.1619 Å для $n\text{-}\text{Bi}_2\text{Te}_3$ и 10.1650 Å для $\text{Bi}_2\text{Te}_3\langle\text{Cu}\rangle$.

Таким образом, увеличение периода структуры d и у «постаревших» образцов составляет $\Delta d \approx 3 \cdot 10^{-3}$ Å.

Если этот результат связан с упорядочением нейтральных атомов Cu в ван-дер-ваальсовых промежутках, то он должен сопровождаться уменьшением концентрации носителей заряда. Действительно, на исследуемых образцах обнаружено уменьшение концентрации n от $2.1 \cdot 10^{19}$ до $9.7 \cdot 10^{18}$ см $^{-3}$.

Одновременно изменение расстояния между квинтетами должно привести к прогнозируемому изменению энергетического спектра теллурида висмута. Согласно модели химической связи в Bi_2Te_3 [4], электронные валентные плотности атомов Te $^{(1)}$, находящихся на краю квинтетов, почти полностью втянуты внутрь слоев, так что между ними существует лишь слабое притяжение. Нейтральные атомы меди,

раздвигающие квинкеты, повышают потенциальный барьер. Это в свою очередь должно привести энергетический спектр кристалла к более двумерному виду. С другой стороны, так как структура пятислойного пакета не изменяется, то его потенциальный рельеф остается прежним. Поэтому энергетические зоны, связанные с атомными состояниями, размещенными в плоскости квинкета, должны остаться неизменными. Наоборот, те энергетические зоны, которые соответствуют электронным состояниям, размещенным в направлении, перпендикулярном плоскостям (ось z), должны чувствовать изменение потенциального барьера между квинкетами. Согласно [5], симметрия кристалла Bi_2Te_3 запрещает в высокосимметричных точках зоны Бриллюэна смешивание состояний $|s\rangle$ и $|d_z^2\rangle$ с $|p_x\rangle$ и $|p_y\rangle$, а $|d_z^2\rangle$ с остальными d -состояниями. В низкосимметричных точках зоны Бриллюэна допускается смешивание всех состояний.

Поскольку известно [5] каким состояниям соответствуют энергетические зоны Bi_2Te_3 , можно определить номера зон, чувствительных и нечувствительных к изменению параметра d .

В рамках метода псевдопотенциала были оценены смещения энергетических зон в симметричных точках зоны Бриллюэна при изменении параметра d . Нечувствительными к изменениям параметра решетки оказались зоны $c2$, $c3$, $v9$, $v11$, $v13$ в точках Γ , L , Λ (обозначение согласно [5]).

Сравнение изменения энергии критических точек при изменении ширины ван-дер-ваальсовой щели на $\Delta \alpha$ с экспериментальными значениями энергии переходов по спектрам электроотражения

Особенности спектров электроотражения				Номера зон v_i , с (i, j)	Симметрия перехода	Теоретический сдвиг $\Delta E = E_i - E'_i$, эВ при $\Delta d = 3 \cdot 10^{-3}$ Å
до старения		после старения				
E_i	E , эВ	E_i'	E , эВ			
E_1	1.73	E_1	1.685	14.2	$L_6^- \rightarrow L_6^-$	0.044
		E_1'	1.705	14.3	$L_6^- \rightarrow \{L_4^+ + L_5^-\}$	0.015
E_2	1.95	E_2	1.860	9.1	$\{\Xi_3 + \Xi_4\} \rightarrow \{\Xi_3 + \Xi_4\}$	0.110
		E_2'	1.880	11.1	$\{\Xi_3 + \Xi_4\} \rightarrow \{\Xi_3 + \Xi_4\}$	—
				13.2	$\{\Xi_3 + \Xi_4\} \rightarrow \{\Xi_3 + \Xi_4\}$	0.057
				14.2	$\{\Lambda_4 + \Lambda_5\} \rightarrow \Lambda_6$	—
				14.3	$\{\Xi_3 + \Xi_4\} \rightarrow \{\Xi_3 + \Xi_4\}$	—
E_3	2.03	E_3	1.95	14.2	$\{\Xi_3 + \Xi_4\} \rightarrow \{\Xi_3 + \Xi_4\}$	0.068
				14.3	$\{\Xi_3 + \Xi_4\} \rightarrow \{\Xi_3 + \Xi_4\}$	—
E_4	2.27	E_4	2.24	13.2	$\{\Xi_3 + \Xi_4\} \rightarrow \{\Xi_3 + \Xi_4\}$	—
				14.3	$\{\Xi_3 + \Xi_4\} \rightarrow \{\Xi_3 + \Xi_4\}$	0.0021

В низкосимметричных точках зоны Бриллюэна сдвиг происходит у всех зон, что приводит к уменьшению энергетических зазоров. В высокосимметричных точках из-за неодинаковой чувствительности зон изменяются не все энергетические промежутки.

Такой результат должен повлиять на размещение особенностей в оптических спектрах. Те из них, которые соответствуют переходам только в низкосимметричных точках, должны сдвигаться в сторону меньших энергий, а те, в которые дают вклад переходы между зонами разной чувствительности в высокосимметричных точках и одновременно в низкосимметричных, должны расщепиться на серии пиков.

Результаты теоретических расчетов сравнивались с данными анализа Крамерса—Кронига спектров электроотражения, полученных на начальной и конечной стадиях «старения». В таблице приводятся соответствующие данные.

Полученные результаты подтверждают реальность процесса самоинтеркаляции, который происходит в кристаллах $\text{Bi}_2\text{Te}_3\langle\text{Cu}\rangle$ со временем при их старении.

Список литературы

- [1] Гольцман Б. М., Кудинов Б. А., Смирнов И. А. Полупроводниковые термоэлектрические материалы на основе Bi_2Te_3 . М., 1972. 320 с.
- [2] Wyckoff R. W. G. Crystal Structures. Interscience. V. 2. 1967. 588 p.
- [3] Weiss J. et al. // Z. Phys. Chemie. Neue Folge. 1960. V. 2. P. 145.
- [4] Кузнецов В. Г. // Химическая связь в полупроводниковых и твердых телах. Минск, 1965. С. 311.
- [5] Олешко Е. В., Королышин В. Н. // УФЖ. 1986. Т. 31. В. 6. С. 919—924.

Институт физики АН АзССР
Баку

Получено 21.12.1990
Принято к печати 28.01.1991

ФТП, том 25, вып. 6, 1991

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ МАРГАНЦА И НИКЕЛЯ ПРИ ДИФФУЗИОННОМ ЛЕГИРОВАНИИ КРЕМНИЯ

Абдурахманов К. П., Куликов Г. С., Лебедев А. А.,
Утамурадова Ш. Б., Юсупова Ш. А.

Межпримесное взаимодействие в полупроводниках является одним из факторов, определяющих зачастую электрофизические свойства материала. Применительно к кремнию такое взаимодействие может происходить, например, между быстродиффундирующими примесями переходных металлов, неконтролируемое проникновение которых в приборную структуру может приводить к деградации параметров кремниевого прибора.

Целью настоящей работы было исследование взаимодействия в кремнии быстродиффундирующих примесей Mn и Ni, вносящих глубокие уровни (ГУ) в запрещенную зону кремния. Исследование проводилось с использованием радиоактивной методики, а также нестационарной емкостной спектроскопии глубоких уровней (DLTS). Известно, что примесь марганца создает в запрещенной зоне Si донорные уровни $E_d = -0.13$, $E_d = -0.20$, $E_d = -0.42$ и $E_d = -0.54$ эВ [1], а примесь никеля — акцепторные уровни $E_a = -0.20$ и $E_a = -0.41$ эВ [2] (по данным, приведенным в монографии Милнса [3], положение акцепторных уровней никеля соответствует $E_a = +0.23$ и $E_a = -0.35$ эВ). Коэффициенты диффузии примесей марганца и никеля в кремнии при 1200°C составляют $D_{\text{Mn}} = 1 \cdot 10^{-5}$ и $D_{\text{Ni}} = 5 \cdot 10^{-5} \text{ см}^2/\text{с}$, а их растворимости соответственно — $N_{\text{Mn}} = 2 \cdot 10^{16}$ и $N_{\text{Ni}} = 5 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ [2].

Объектами исследования служили образцы размерами $14 \times 7 \times 2$ мм, вырезанные из слитка монокристаллического кремния n -типа, выращенного по методу Чохральского. Удельное сопротивление образцов составляло $\sim 5 \text{ Ом}\cdot\text{см}$.

Порядок эксперимента сводился к следующему: вначале диффузионным способом (первичный отжиг) образцы легировались радиоактивным изотопом марганца и исследовалось его концентрационное распределение в нескольких образцах; затем после обработки двумя различными способами образцов, диффузионно насыщенных радиоактивным марганцем, в них в процессе повторного отжига проводилась диффузия нерадиоактивного никеля и далее анализировалось концентрационное распределение примеси марганца в таких образцах с никелем, а также в контрольных образцах, прошедших повторный диффузионный отжиг (без никеля). Сравнение диффузионных профилей марганца в образцах с никелем и без него (в том числе и в контрольных), а также данных по наличию ГУ марганца или никеля в образцах, прошедших аналогичные эксперименты с нерадиоактивным марганцем, позволило сделать определенные заключения по поводу взаимодействия указанных примесей при их диффузионном введении в кремний.